

Erläuterungen

Allgemeiner Teil

Im Maß- und Eichgesetz (MEG) ist in § 15 enthalten, dass die dort festgelegten Nacheichfristen hinsichtlich bestimmter Messgeräte durch Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit (jetzt Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft) um jeweils höchstens fünf Jahre verlängert werden können, wenn durch Prüfungen von Teilmengen der in einem bestimmten Jahr geeichten Messgeräte nach festzulegenden allgemein anerkannten statistischen Verfahren zu erwarten ist, dass die Richtigkeit und Zuverlässigkeit dieser Messgeräte für diesen Zeitraum gewährleistet ist.

Mit der jüngsten Novelle zum MEG, BGBl. I Nr. 72/2017, wurde nunmehr die Möglichkeit geschaffen, dass Eichstellen gemäß § 35 MEG mit entsprechender Ermächtigung, technische Prüfungen für die Verlängerung der Nacheichfristen durchführen können.

Damit einhergehend ist es erforderlich auf Basis der vorliegenden Novellierung der Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit (nunmehr Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft) betreffend Eichstellen, entsprechende Regelungen für diese Erweiterung des Tätigkeitsbereiches um die technischen Prüfungen für die Verlängerung der Nacheichfrist auf Grund statistischer Prüfungen im Hinblick auf Rechte und Pflichten, Verfahren und Überwachung vorzusehen.

Diesbezüglich finden sich in der gegenständlichen Novelle insbesondere Anforderungen, die von den Eichstellen, die diese Tätigkeiten künftig durchführen wollen, zu erfüllen sind. Da diese Eichstellen die zusätzliche Ermächtigung beantragen und auch entsprechende Verfahren entwickeln und implementieren müssen (z. B. Verfahrensanweisung für die Abwicklung und Durchführung der technischen Prüfungen, Verantwortlichkeiten) ist es nicht zielführend, für diese Verordnung einen beschränkten Gültigkeitszeitraum („sunset clause“) vorzusehen.

Besonderer Teil

Zu Z 1 und Z 2 (Titel und § 2):

Diese Bestimmung enthält Aktualisierungen im Hinblick auf die letzte MEG-Novelle sowie betreffend die bestehende Ressortbezeichnung.

Zu Z 3 bis 7, 9 und 10 (§ 3 Abs. 6, § 5, § 6 Abs. 1, § 6a, § 7 Abs. 1 Z 1, 3 und Abs. 4, § 10 Abs. 2 Z 4):

In der Eichstellenverordnung sind ergänzende Bestimmungen erforderlich, die die Vornahme der technischen Prüfungen für die statistische Verlängerung von Messgeräten regeln. So muss zumindest ein Zeichnungsberechtigter, der für diese Tätigkeiten über die erforderliche Sachkunde verfügt vorhanden sein, der in Folge auch die Verantwortung für die ordnungsgemäße Prüfung und für die erstellten Prüfberichte trägt.

In § 5 ist zu den bereits bestehenden Berechtigungen von Eichstellen, die durch die MEG-Novelle BGBl. I Nr. 72/2017 neu hinzukommende Berechtigung zur Vornahme von technischen Prüfungen für die statistische Verlängerung von Nacheichfristen aufzunehmen.

In § 6 wird klargestellt, dass diese Regelung für eichtechnische Prüfungen von Messgeräten gilt; davon zu unterscheiden sind die technischen Prüfungen von Teilmengen von Messgeräten nach § 18 Z 2 lit. b MEG.

Da die technischen Prüfungen im Sinne des § 18 Z 2 lit. b MEG im Zusammenhang mit § 6a durch die Verordnungen geregelt werden, ist festzulegen, nach welchen Anforderungen die Prüfungen vorzunehmen sind. Gleichzeitig ist festzulegen, innerhalb welchen Zeitraumes eine ermächtigte Eichstelle die Prüfungen an das BEV zu übermitteln hat.

Der Bescheid betreffend die Ermächtigung zur Vornahme der technischen Prüfungen für die statistische Verlängerung der Nacheichfristen hat die verantwortlichen Personen für diese technische Prüfung zu enthalten.

Zu Z 8 (§ 7 Abs. 1 Z 3):

Die derzeitige Bestimmung der Eichstellenverordnung legt fest, dass Stempelmaterialien mit Daten des letzten Jahres am Ende des Monats Jänner des Folgejahres vernichtet werden müssen. Bei der kurzfristigen Öffnung nach § 45a MEG werden Stempelstellen verletzt. Gemäß § 45a Abs. 1 Z 7 MEG sind jedoch „alle durch die kurzfristige Öffnung verletzten Stempelstellen wiederherzustellen“. Dies bedingt, falls es sich bei der verletzten Stempelung um den Eichstempel handelt, das Vorhandensein von Stempelmaterialien aus Vorjahren. Daher wird die Bestimmung im Hinblick auf die Anforderungen für die „kurzfristige Öffnung“ angepasst. Die Aufbewahrungsfristen der Stempel sollten jedoch die Nacheichfristen der zu eichenden Messgeräte nicht übersteigen.

Zu Z 11 (§ 10 Abs. 6 Z 2, 3 und 4):

Dieser Teil regelt die Entziehungstatbestände und ist um Bestimmungen bezüglich der technischen Prüfungen für die statistische Verlängerung der Nacheichfristen zu ergänzen.

Zu Z 12 und 13 (§ 11 Abs. 9 und § 12 Abs. 3):

Das BEV hat die ordnungsgemäße Durchführung der Verfahren betreffend die technischen Prüfungen für die statistische Verlängerung der Nacheichfristen zu überwachen. Losumfang und Stichprobenumfang werden für die verschiedenen Messgerätearten auf Grundlage der Verordnungen gemäß § 18 Z 2 lit. b MEG festgelegt.

Die Anzahl der behördlichen Überwachungen steht in Relation zu den jährlich von der ermächtigten Eichstelle zu prüfenden Losen. Die Behörde hat jährlich zumindest bei einer Losprüfung der ermächtigten Eichstelle überwachend tätig zu sein. Sofern eine Eichstelle mehr als eine Losprüfung jährlich durchführt, hat das BEV Überwachungen im Ausmaß von 5 % – gerechnet aus der Gesamtanzahl der von der Eichstelle geprüften Lose pro Kalenderjahr – vorzunehmen. Dies bedeutet, dass mindestens eine Prüfung pro Jahr stattfindet, wobei im Fall einer entsprechend hohen Anzahl an Losprüfungen auch die Anzahl der Überwachungen steigt. Entsprechende Regelungen sind in die Verordnung daher aufzunehmen. Auch technische Prüfungen von bereits geprüften Messgeräten können im Rahmen dieser Überwachung vorgenommen werden.

Zu Z 14 (§ 13 Abs. 9):

Um die Überwachung durchführen zu können, müssen die geplanten Prüfungen dem BEV fristgerecht unter Verwendung der Eichstellendatenbank gemeldet werden. Der Inhalt dieser Meldung wird durch diese Bestimmungen konkret festgelegt.

Zu Z 15 (§ 16):

Der Hinweis auf die vorgenommene Notifizierung für diese Novelle ist in § 16 aufzunehmen.

Zu Z 16 (§ 16a):

Der Hinweis auf die sprachliche Gleichbehandlung ist aufzunehmen.